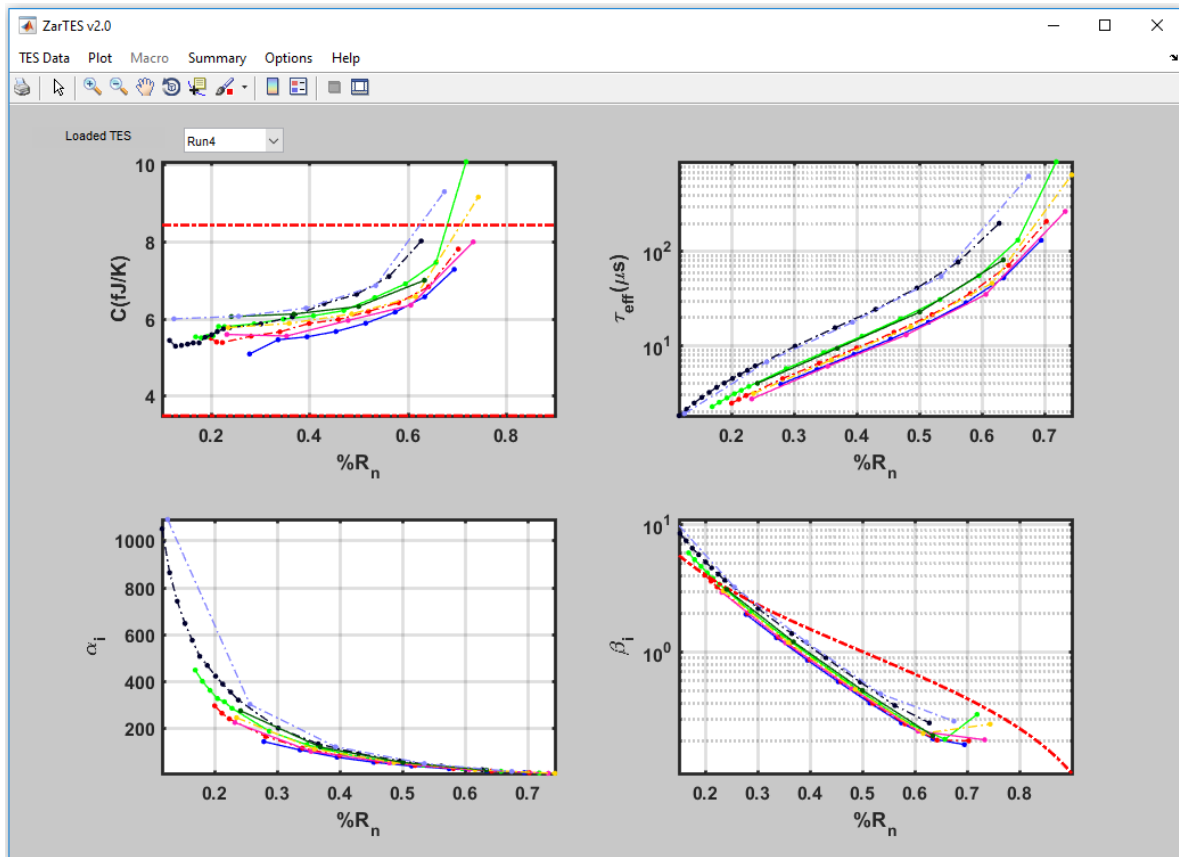


TES Analyzer - Guía de usuario

14 de octubre de 2019



Índice

1	Menus	4
1.1	TES Data	4
1.2	Load TES	4
1.3	TES Analysis	4
1.3.1	Set Data Path	4
1.3.2	Test Device	5
1.3.2.1.	TES Dimensions	5
1.3.2.2.	Absorbent Dimensions	5
1.3.2.3.	Circuit Values	5
1.3.3	I-V Curves	5
1.3.3.1.	Import I-V Curves	5
1.3.3.2.	Check I-V Curves	6
1.3.3.3.	Fit P vs. T	6
1.3.3.4.	TES Thermal Parameters vs. %Rn	6
1.3.3.5.	TES Thermal Parameter Values	7
1.3.3.6.	Get G(T)	7
1.3.4	TF Superconductor	7
1.3.4.1.	Load TF in Superconductor State (TFS)	7
1.3.4.2.	Check TFS	7
1.3.5	TF Normal	7
1.3.5.1.	Load TF in Normal State (TFN)	7
1.3.5.2.	Check TFN	7
1.3.6	Z(w)-Noise Analysis	8
1.3.6.1.	Z(w) Derived L	8
1.3.6.2.	Fit Z(w)-Noise to ElectroThermal Model	8
1.3.7	Critical Currents	8
1.3.7.1.	Import Critical Currents	8
1.3.8	Field Scan	8
1.3.8.1.	Import Field Scan	8
1.4	Re-Analyze Loaded TES	9
1.5	Save TES Data	9
2	Plot	10
2.1	Plot NKGT set	10
2.2	Plot ABCT set	10
2.3	Plot TF vs Tbath	10
2.4	Plot Noise vs Tbath	10
2.5	Plot TES Data	10
2.6	Plot Critical Currents	11
2.7	Plot Field Scan	11

3	Macro	11
4	Options	11
5	Summary	11
5.1	TF-Noise Viewer	11
5.2	Word Graphical Report	12
6	Help	12

1. Menus

En esta sección se van a explicar los menús que contiene el interfaz gráfico que permite analizar los datos experimentales de la caracterización de los TES.

Los menús que encontramos al abrir la aplicación son:

- TES Data
- Plot
- Macro
- Options
- Summary
- Help

A continuación se desglosan cada uno de estos menús con los respectivos submenús con una breve descripción de los mismos.

1.1. TES Data

En este menú se encuentran las opciones de: Cargar los datos de análisis previos, realizar un nuevo análisis y salvar los datos corrientes de los análisis en curso.

1.2. Load TES

Se procederá a cargar un archivo “*.mat” que contiene una estructura con todos los datos propios de un análisis de los datos experimentales de la caracterización de un TES: curvas IV, $Z(w)$ y ruidos.

1.3. TES Analysis

Desde este menú se accede a los submenús que permiten realizar un análisis nuevo o re-analizar un TES que ya se haya cargado previamente.

En caso de un análisis nuevo, los submenús se habilitarán progresivamente para que se desarrolle un correcto análisis. Los pasos a seguir son los siguientes:

1.3.1. Set Data Path

Selección de la carpeta que contiene los archivos y carpetas de una toma de datos. Dada la disposición de carpetas, se busca que esta carpeta o path sea una nombrada como $Z(w)$ -Ruido. En la nueva disposición de los datos, la carpeta pasa a ser un RUN00X, siendo X el número de RUN.

1.3.2. Test Device

En este menú el usuario encontrará dos submenús relacionados con: los valores del circuito en el que se encuentra el TES y las dimensiones físicas del TES.

1.3.2.1 TES Dimensions

Dimensiones físicas del TES, length y width y los espesores de las bicapas de molibdeno y oro.

1.3.2.2 Absorbent Dimensions

Dimensiones físicas del absorbente. La existencia de un absorbente en el TES se traduce en una estimación fija de los valores del parámetro C (nomenclatura C_{fixed}) y los parámetros derivados de éste como α_{fixed} .

1.3.2.3 Circuit Values

En este submenú, el usuario verificará los valores de los parámetros asociados con la polarización del SQUID, el valor de la resistencia de feedback R_f . Es importante verificar que estos valores corresponden con la toma de datos. Para verificarlo es conveniente cargar el archivo session/circuit que contendrá la variable circuit (Cargar en Matlab).

1.3.3. I-V Curves

1.3.3.1 Import I-V Curves

El usuario decidirá que rango de temperaturas va a considerar a la hora de cargar curvas I-V. Después, seleccionará la carpeta que contiene los archivos relacionados con las curvas I-V nombrados como \$Temp\$_mK_Rf \$Rf \$K_(down|up)_(p|n)_matlab.txt. Una vez cargadas las curvas I-V con rango de I_{bias} positivo, el software procederá con las de I_{bias} negativas. Se ha incluido la corrección de las curvas I-V para evitar asimetrías entre positivas y negativas. Este módulo ofrece la posibilidad de corregir las curvas I-V para que a corriente 0 tengan un voltaje 0 eliminando posibles offsets. Existen 2 métodos de corrección: a) Forzed zero-zero y b) Respect to Normal Curve. a) Forzed zero-zero: el algoritmo lo que hace es restar a todos los binomios de la curva el valor que corresponde en voltaje a corriente nula, de forma individualizada. b) Respect to Normal Curve: en este algoritmo es muy importante que el rango de temperaturas supere la temperatura crítica esperada del TES, ya que la curva I-V de la temperatura superior se tomará como referencia para alinear todas las demás con respecto al valor de corriente de $500 \mu A$. De las curvas de I-V se obtiene una estimación de la pendiente en estado normal (con los puntos de mayor corriente) y en estado superconductor (con los puntos cercanos a corriente nula). El punto de cruce de la proyección de dos rectas con ambas pendientes determinará el punto a corregir para que se sitúe en el origen de coordenadas. Una vez finalizada la corrección de las curvas de forma automática se procede a verificar las curvas I-V de forma visual, Check I-V Curves.

1.3.3.2 Check I-V Curves

Las curvas I-V son representadas como Vout-Ibias, PTes-VTes, ITes-VTes, y PTes-%Rn. Las primeras curvas I-V que son representadas son las que pertenecen a Ibias positivo. Una ventana emergente avisará de que antes de cerrarla, el usuario tiene la opción de eliminar del análisis aquellas curvas I-V que crea que no cumplen los requisitos. Una vez filtradas las curvas I-V de Ibias positivas, el usuario debe cerrar la ventana emergente para continuar con las curvas I-V de Ibias negativas repitiendo el mismo proceso.

Opciones de botón derecho del ratón: Pinchando sobre una curva I-V con el botón derecho del ratón, un menú, mostrando el nombre del archivo que produce esa curva, se habilita para que el usuario pueda eliminarla del análisis.

1.3.3.3 Fit P vs. T

Ajuste a un modelo de P-Tbath a valores porcentuales de Rn. El software está configurado para ajustar al modelo $P(T) = P_0 = K * T c^n$. El software nos proporcionará cuatro posibles métodos para realizar el ajuste: PTes vs VTes; PTes vs RTes; Minimum I-V curve transition; y Rango %Rn.

En el caso de PTes vs VTes, se usan estas curvas para obtener los valores de %Rn para el ajuste en función de un umbral. Análogamente en el caso de PTes vs RTes se obtienen los valores de %Rn pero con estas otras curvas. Ambos métodos están basados en la derivada de las curvas y un umbral para detectar una desviación sobre las derivadas.

En el caso de Minimum I-V curve transition, los valores de %Rn para el ajuste serán tomados en los puntos de cero pendiente (correspondientes a la transición) de las curvas I-V.

En el caso de Rango %Rn, el software nos proporcionará el mayor rango de %Rn basado en las curvas de PTes-%Rn. Una gráfica se mostrará con los valores de P-Tbath y el ajuste.

Opciones de botón derecho del ratón: Pinchando sobre los valores de P-Tbath, un menú mostrará el porcentaje de Rn al que corresponde ese punto y los archivos que han sido utilizados para realizar el ajuste. Pinchando sobre la curva de ajuste se mostrará el conjunto de parámetros que conforman el ajuste.

1.3.3.4 TES Thermal Parameters vs. %Rn

Sólo en el caso de dar un Rango %Rn los parámetros térmicos del TES serán representados en función de los valores de %Rn. El usuario decidirá el punto de operación del TES fijando el valor de porcentaje de Rn de forma manual. En caso de fijar un porcentaje de Rn que no tenga representación, los valores térmicos del TES se calcularán al valor máximo de %Rn. Para los otros casos, los valores térmicos serán mostrados en una tabla, primero para el rango de Ibias positivo y después para los de Ibias negativos.

Opciones de botón derecho del ratón: Pinchando el fondo de una de las gráficas se habilita un menú con las opciones de: Show (Positive/Negative/All); Activate/Deactivate error bars; Hide/Show Negative Ibias Data, Export Graphic Data (produce un archivo txt con el contenido de esa gráfica); Save Graph; Link all x axes (Opción que hace que todas las gráficas estén afectadas a la vez por el zoom en el eje x)

1.3.3.5 TES Thermal Parameter Values

Los parámetros térmicos del TES son representados en una tabla.

1.3.3.6 Get G(T)

De acuerdo con el modelo fijado del ajuste de P-Tbath, el usuario tiene la opción de conocer el valor de G a cualquier temperatura.

1.3.4. TF Superconductor

Por razones de los pasos que se dan en el análisis, es necesario cargar una función de transferencia del TES en estado superconductor. Esta función de transferencia presentará un recorrido típico de una U invertida en la representación del plano complejo. Se suele tomar una función de transferencia adquirida a bajo I_{bias} pero sin llegar a 0.

1.3.4.1 Load TF in Superconductor State (TFS)

El usuario deberá de seleccionar una función de transferencia que pertenezca al TES en estado superconductor. Para ello, se aconseja que en el archivo figure una corriente muy baja para asegurar el estado superconductor. El software realizará una representación de esta función de transferencia y preguntará al usuario si ésta es válida como TF en estado superconductor.

1.3.4.2 Check TFS

El software realizará una representación de esta función de transferencia y preguntará al usuario si ésta es válida como TF en estado superconductor.

1.3.5. TF Normal

La función de transferencia en estado normal se utilizará para calcular el valor de L a partir de ésta y la función de transferencia en estado superconductor.

1.3.5.1 Load TF in Normal State (TFN)

El usuario deberá de seleccionar una función de transferencia que pertenezca al TES en estado normal. Para ello, se aconseja que en el archivo figure una corriente muy alta, o a una temperatura superior a la temperatura crítica, para asegurar el estado normal. El software realizará una representación de esta función de transferencia y preguntará al usuario si ésta es válida como TF en estado normal.

1.3.5.2 Check TFN

El software realizará una representación de esta función de transferencia y preguntará al usuario si ésta es válida como TF en estado normal.

1.3.6. Z(w)-Noise Analysis

1.3.6.1 Z(w) Derived L

El valor de la autoinducción del circuito se puede estimar a partir de las funciones de transferencia en estado normal y superconductor. El valor de L se utiliza en el análisis posterior para el cálculo de α , C , τ_{eff} , β .

1.3.6.2 Fit Z(w)-Noise to ElectroThermal Model

Llegados a este punto, los datos registrados de funciones de transferencia y ruido van a ser ajustados a un modelo electro-térmico y de ruido. En la versión actual el modelo electro-térmico es de un bloque y el modelo de ruido es el modelo de Irwin. El software preguntará si queremos representar las funciones de transferencia durante el proceso de carga y ajuste. El usuario podrá ajustar el rango de frecuencias a las que se realizará el ajuste. El proceso se repetirá para el caso de Ibias negativo. Al finalizar la carga y el ajuste, el programa ofrece la posibilidad de eliminar algunas de estas funciones de transferencia para el posterior análisis. La evolución de los parámetros térmicos del modelo serán representados junto con sus barras de error.

Los ajustes al modelo electro-térmico que produzcan valores de α_i o C negativos serán marcados como datos filtrados y no se representarán. De la misma forma si el modelo produce valores porcentuales de R_n fuera del rango [0-1] serán descartados.

1.3.7. Critical Currents

En este menú se lleva a cabo la importación de los archivos que permitirán visualizar las corrientes críticas en función del campo magnético aplicado a distintas temperaturas.

1.3.7.1 Import Critical Currents

El software pedirá al usuario que indique en qué carpeta debe de buscar para la importación de los archivos que permitirán visualizar las corrientes críticas en función del campo magnético aplicado a distintas temperaturas. Los archivos de corrientes críticas serán almacenados durante el proceso de adquisición en una carpeta nombrada como Barrido_Campo.

1.3.8. Field Scan

En este menú se lleva a cabo la importación de los archivos que permitirán visualizar el voltaje máximo en función del campo magnético en un punto de operación específico del TES a distintas temperaturas.

1.3.8.1 Import Field Scan

El software pedirá al usuario que indique en qué carpeta debe de buscar para la importación de los archivos que permitirán visualizar el voltaje máximo en función del campo magnético en un punto de operación específico del TES a distintas temperaturas. Los archivos de escaneo

del campo serán almacenados durante el proceso de adquisición en una carpeta nombrada como Barrido_Campo.

Opciones generales de botón derecho del ratón: Un menú para guardar la figura corriente se habilita pinchando sobre el exterior de las figuras (fondo gris). Al aceptar, se genera una nueva figura replicando la actual y un cuadro de diálogo (opcional) para guardar la figura en formato *jpg*. Además, la nueva figura podrá ser guardada en el formato que el usuario desee usando los propios menús de File → Save As.

En caso de haber cargado un análisis previo, permitirá comprobar los ajustes o re-analizarlo con nuevos parámetros.

1.4. Re-Analyze Loaded TES

Este módulo permite el re-análisis de un TES que ya ha sido analizado anteriormente. El usuario tendrá que cambiar los parámetros que considere y se procede de forma automática a realizar cada paso. (Pendiente el que se puedan analizar un conjunto de TES).

1.5. Save TES Data

Todos los TES cargados pueden volver a guardarse. Si se ha realizado un re-análisis conviene guardarlo con un nombre distinto del original para poder realizar comparaciones entre ambos (ver Menú “Macro”).

Estos análisis serán guardados en un archivo “*.mat”.

2. Plot

Este menú se habilita cuando los TES cargados están ya analizados.

2.1. Plot NKGt set

Permite la visualización de las gráficas de las que se determinan los parámetros térmicos del TES.

Opciones de botón derecho del ratón: Pinchando el fondo de una de las gráficas se habilita un menú con las opciones de: Show (Positive/Negative/All); Activate/Deactivate error bars; Hide/Show Negative Ibias Data, Export Graphic Data (produce un archivo txt con el contenido de esa gráfica); Save Graph; Link all x axes (Opción que hace que todas las gráficas estén afectadas a la vez por el zoom en el eje x; Change X axes limits, permite variar los límites del eje x; Change Y axes limits, permite variar los límites del eje y).

2.2. Plot ABCT set

Representación de los parámetros C , τ_{eff} , α_i , y β_i con respecto a R_n .

Opciones de botón derecho del ratón: Pinchando sobre un punto de la gráfica, se mostrará su origen, es decir a qué punto corresponde de Ibias, y opciones entre las que se encuentra el filtrado de ese punto. Además, si pinchamos sobre el fondo del gráfico (no sobre puntos), se muestra otro submenú para poder visualizar las barras de error de los parámetros análogo al de “Plot NKGt set”.

2.3. Plot TF vs Tbath

Produce una serie de gráficas visualizando las $Z(w)$ en función de la $R_n(\%)$. Una vez que se muestran las gráficas de TF vs Tbath, el software ofrece la posibilidad de graficar la parte real y la parte imaginaria de $Z(w)$ vs frecuencia para el rango de $\%R_n$ seleccionado.

2.4. Plot Noise vs Tbath

De forma análoga a “Plot Noise vs Tbath” visualizará los diferentes ruidos adquiridos en función de $R_n(\%)$.

2.5. Plot TES Data

El usuario podrá seleccionar la representación de cualquier parámetro con respecto a Tbath, respecto a $R_n(\%)$ o respecto a cualquier otro parámetros a elección.

Opciones de botón derecho del ratón: Pinchando sobre un punto de la gráfica cuando se representa un parametro vs $\%R_n$, se mostrará su origen, es decir a qué punto corresponde de Ibias, y opciones entre las que se encuentra el filtrado de ese punto. Pinchando el fondo de una de las gráficas se habilita un menú con las opciones de: Show (Positive/Negative/All); Activate/Deactivate error bars; Hide/Show Negative Ibias Data, Export Graphic Data (produce un archivo txt con el contenido de esa gráfica); Save Graph; Link all x axes (Opción que hace

que todas las gráficas estén afectadas a la vez por el zoom en el eje x; Change X axes limits, permite variar los límites del eje x; Change Y axes limits, permite variar los límites del eje y).

2.6. Plot Critical Currents

Representación de las corrientes críticas en función del campo magnético aplicado a distintas temperaturas.

2.7. Plot Field Scan

Representación del voltaje máximo en función del campo magnético aplicado a distintas temperaturas.

3. Macro

Este menú se habilita cuando hay al menos 2 análisis cargados o en curso. Permite la comparación entre análisis de varios TES a la vez. Las gráficas producidas en el menú “Macro” heredan las opciones de botón derecho del ratón de las gráficas del menú “Plot”.

4. Options

Desde este menú se accede a las opciones de visualización de ciertos parámetros relacionados con el modelo de ajuste P vs T; el modelo electro-termico de ajuste; y las opciones para realizar el informe del análisis realizado.

En la versión corriente, la adquisición de los datos se lleva a cabo mediante dos aparatos de medida: un Digital Signal Analyzer (HP), y una tarjeta de adquisición de datos (PXI). No se garantiza que siempre se disponga de datos adquiridos con ambos instrumentos, sin embargo el interfaz nos permitirá poder decidir cuales de ellos queremos utilizar para el análisis. En versiones más avanzadas se espera poder prescindir del HP.

5. Summary

En este menú se accede a dos submenús.

5.1. TF-Noise Viewer

Es un interfaz para la visualización del análisis de $Z(w)$ -Ruido. El usuario puede hacer uso de las flechas del teclado para avanzar o retroceder en la visualización de las diversas $Z(w)$ y Ruidos. Además cuenta con opciones extras al hacer click sobre las gráficas con el botón derecho del ratón en ambas gráficas.

5.2. Word Graphical Report

Es un asistente para la generación de un archivo Word en el que se incluyen un resumen del análisis corriente: datos del circuito, parámetros térmicos, curvas I-V, gráficas $Z(w)$, ruidos, etc.

6. Help

Finalmente, en este menú se accede a esta guía de usuario y a los patrocinadores que han hecho posible el desarrollo de este interfaz gráfico.